

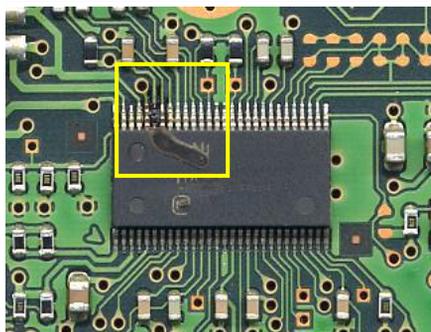
マイクロフォーカスX線観察事例



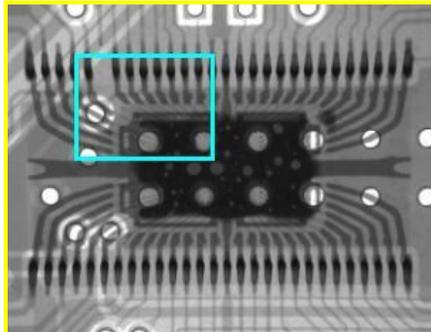
信頼性試験～解析まで一貫体制
内藤電誠工業(株)

焦点寸法0.4 μm の高分解能、高倍率、高輝度により、非破壊で電子デバイス内部の詳細観察が可能です。

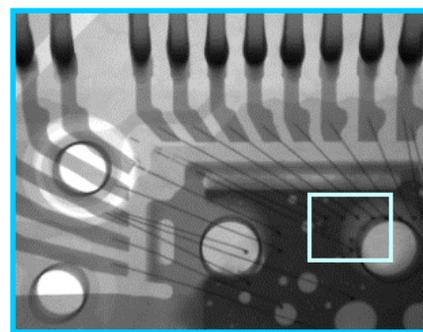
SOPパッケージ焼損箇所:内部状態の詳細観察



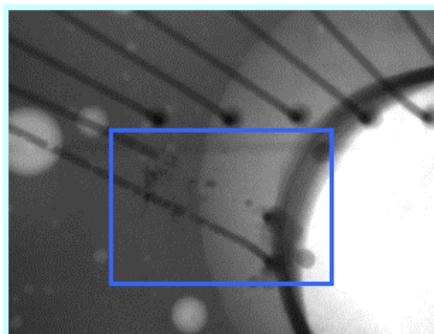
56pinSOPパッケージ焼損



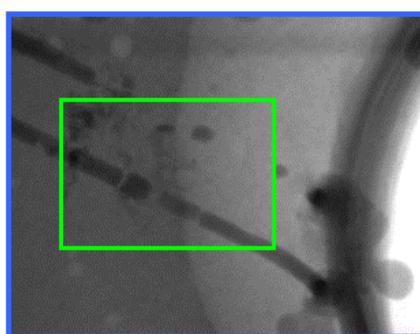
SOP全体観察像



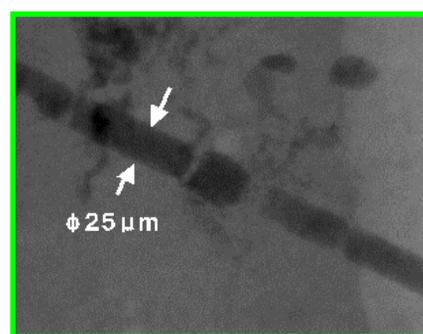
焼損箇所拡大:140倍



ワイヤ断線箇所:140倍

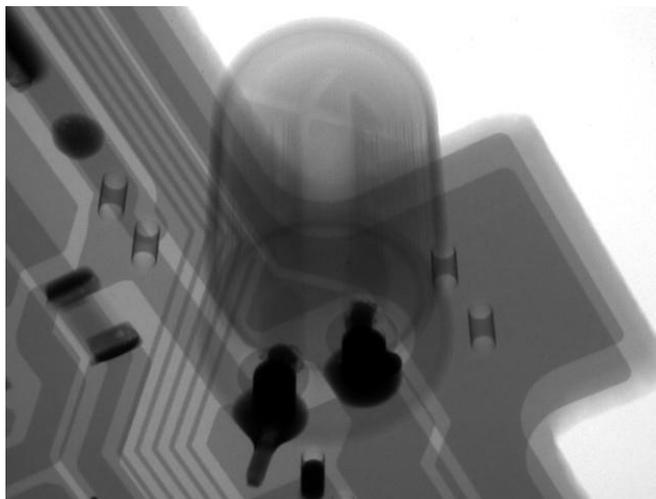


ワイヤ溶融消失:300倍



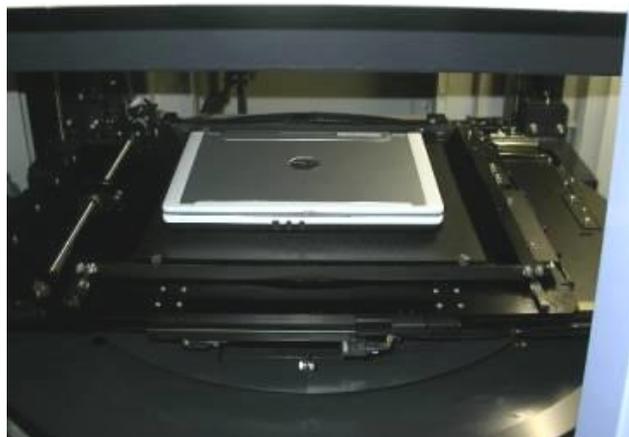
ワイヤ径計測:600倍

アルミ電解コンデンサ内部状態観察



真上から内部状態が観察しにくいサンプルは、傾斜を掛けて観察が可能です。

大型ステージ装備



300mm×350mm、2kgまで搭載可能。
ノートPCなどもセットし内部観察が行えます。

内藤電誠工業株式会社 評価解析事業部

213-0011 川崎市高津区久本3-9-25

TEL:044-811-5496 FAX:044-850-5851

<https://www.lab.ndk-grp.co.jp/>